

## 서울대학교 PtSi 근적외선 카메라의 특성 조사 및 시험 관측

박원기<sup>1</sup>, 박수종<sup>1</sup>, 우에노 무네타카<sup>2</sup>, 이명균<sup>1</sup>, 홍승수<sup>1</sup>

<sup>1</sup>서울대학교 천문학과

<sup>2</sup>동경대 천문지구과학과

PtSi(Platinum Silicide) 칩은  $1\ \mu\text{m} \sim 5\ \mu\text{m}$ 대의 근적외선을 검출할 수 있는 소자로써, 널리 쓰이는 HgCdTe나 InSb에 비해 낮은 양자효율을 갖고 있지만, 대신 화소들의 균질성이 높다는 장점이 있다. 일본 동경대와 국내의 여러 천문학자들이 공동으로 개발한 서울대학교의 근적외선 카메라는  $512 \times 512$ 개 화소를 갖는 PtSi 칩을 검출기로 장착하고 있으며, 카메라의 제어와 작동은 SUN 워크스테이션을 통하여 이루어진다.

본 발표에서는 이 근적외선 카메라의 특성 조사 결과와 24인치 반사 망원경을 이용한 시험 관측 결과를 보고한다.